

MODEL 58635 系列

特點

- 依據ISO/IEC標準
- 最大可測試6吋晶圓
- 寬廣的測試範圍與高精準溫度控制
- 同時支援Pulse與CW模式操作
- LIV量測: Model 58635-L
近場量測: Model 58635-N
遠場量測: Model 58635-F
LIV與近場2合1量測: Model 58635-LN
- 支援multisite測試
- 可選購高速短脈衝電源功能

光電元件晶圓點測系統 MODEL 58635 系列

隨著光電元件的技術越趨成熟，應用也越來越廣泛。其中，雷射二極體(laser diode)除通訊應用外，也朝消費性應用擴展。因應此全新市場，致茂電子藉由多年累積之光電量測技術，開發專為消費性應用之光電元件晶圓點測系統Model 58635系列機種。

58635系列最大可測試6吋晶圓，並搭配致茂電子之精密測試儀器設備，如電流源與溫度控制器，能滿足雷射二極體測試之嚴苛要求，雷射二極體相關光電特性參數隨溫度變化而有所變異，58635系列機種精準之溫度控制，能提供最穩定、最準確之量測數值。

Model 58635系列因應不同測試需求，共包含4機種：58635-L、58635-N、58635-F、以及58635-LN。

LIV量測系統

致茂電流源提供準確穩定之電流源以及電壓量測，搭配積分球與光譜儀，提供準確之光功率與波長量測。藉由58635-L完整之

軟體功能，所有LIV與波長之相關參數均能在此量測。

近場量測系統

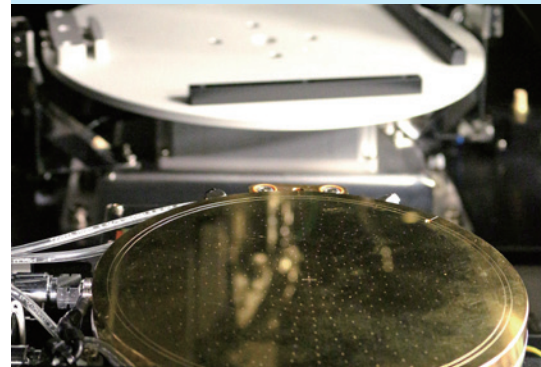
58635-N參照ISO關於雷射近場量測之相關規範，對於雷射二極體之光束傳播比例(beam propagation ratio)或光束品質(beam quality)之相關參數，提供精準快速之量測。

遠場量測系統

58635-F針對雷射二極體之遠場光學特性進行測量，諸如雷射之發光角度。另參照IEC人眼安全相關規範，58635-F能於遠場找尋光束最強之處，從而判斷是否符合人眼安全相關規範。

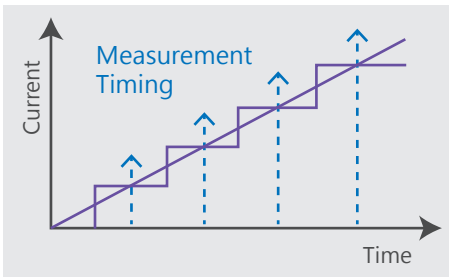
LIV與近場2合1量測系統

58635-LN可在同一次點測中，同時測試LIV與近場量測的所有測試項目。致茂獨特的二合一光學頭設計，使系統在相同機台尺寸下，便能達成LIV與近場的測試，節省寶貴的無塵室空間。



Chroma

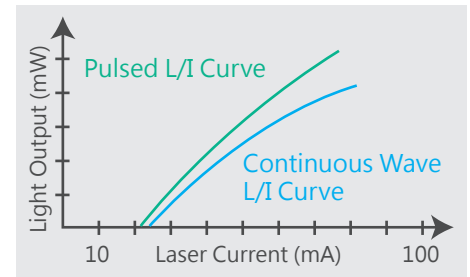
應用範圍



CW mode



Pulse/QCW mode



L/I curve

規格表

Model	58635-L	58635-N	58635-F	58635-LN
Measurements	LIV and λ	Near Field	Far Field	LIV and Near Field two-in-One
Measurement Capability	LIV sweep, Leakage current, I _{th} , Kink, Center wavelength (λ_c), Peak wavelength (λ_p), FWHM	Beam Diameter, Beam divergence angle, Beam propagation ratio, Emitter power uniformity, Dead emitter count	Beam divergence, Max energy/power through 7mm aperture	All LIV & Near Field test items
Optical Test Module	Integrating sphere with spectrometer	CCD Camera with auto focus microscope system	CCD Camera	Special Two-in-One design
Temperature Control Capability	25~85°C (standard) 0~100°C (option)			
SMU Specifications				
Channel Counts	Depend on DUT structure, configurable by PXI base			
SMU Features	PXI base, Bi-polar, 25W/channel, 4 wires, CW and QCW			
Voltage Ranges	$\pm 25V$, $\pm 12.5V$, $\pm 10V$, $\pm 5V$, $\pm 2V$, $\pm 1V$, $\pm 500mV$, $\pm 200mV$, $\pm 100mV$			
Current Ranges	$\pm 6A$ (only pulse mode), $\pm 3.5A$ ($\leq 5V$), $\pm 2.5A$ ($\leq 10V$), $\pm 1A$, $\pm 100mA$, $\pm 10mA$, $\pm 1mA$, $\pm 100\mu A$, $\pm 10\mu A$, $\pm 1\mu A$			
Current Pulse Width	$>100\mu s$			
Pulse Duty Cycle	$<10\%$ (when $2.5A < \text{current} < 3.5A$, pulse width $\leq 5ms$, voltage $< 5V$) $<5\%$ (when $3.5A < \text{current} < 6A$, pulse width $\leq 5ms$, voltage $< 5V$)			

Items	
Coverage Devices	
Wafer Size	2~6 inch
Wafer Thickness	100~3,000 μm
Wafer Warpage	≤ 10 mm
Chip Size	≥ 150 μm
Pad Size	≥ 50 μm
Optical Power	0.1~5,000 mW
Wavelength	800~1,000 nm

* The max. chip size may vary by DUT design and test requirements.

* 所有規格如有變更恕不另行通知。

訂購資訊

58635-L: 光電元件晶圓LIV點測系統

58635-N: 光電元件晶圓近場量測點測系統

58635-F: 光電元件晶圓遠場量測點測系統

58635-LN: 光電元件晶圓LIV&NF點測系統

下載Chroma ATE APP，取得更多產品與全球經銷資訊



iOS



Android

Search Keyword

58635

總公司
致茂電子股份有限公司
333001桃園市龜山區
文茂路88號
T +886-3-327-9999
F +886-3-327-8898
www.chromaate.com
info@chromaate.com

中國
中茂電子(深圳)有限公司
廣東省深圳市南山區
登良路南油天安工業村
4號廠房8F
PC : 518052
T +86-755-2664-4598
F +86-755-2641-9620
www.chromaate.com
info@chromaate.com

東莞服務部
T +86-769-8663-9376
F +86-769-8631-0896

北京分公司
T +86-10-5764-9600/5764-9601
F +86-10-5764-9609

重慶辦公室
T +86-23-6703-4924/6764-4839
F +86-23-6311-5376

致茂電子(蘇州)有限公司
江蘇省蘇州高新區珠江路
855號獅山工業廊 7 號廠房
T +86-512-6824-5425
F +86-512-6824-0732

廈門分公司
T +86-592-826-2055
F +86-592-518-2152

中茂電子(上海)有限公司
上海市欽江路333號40號樓3樓
T +86-21-6495-9900
F +86-21-6495-3964